

БОРИСУ ИВАНОВИЧУ КАПРАНОВУ – 80 ЛЕТ



Доктор технических наук, профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Института неразрушающего контроля, ведущий эксперт Отделения контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета Борис Иванович Капранов родился 9 мая 1941 г. В 1970 г. он окончил Томский государственный университет по специальности «Физика-электроника».

Трудовую деятельность Борис Иванович начал в Томском политехническом университете в 1962 г. в должности лаборанта НИС, в 1968 г. он был переведен на должность инженера НИИ электронной интроскопии, с 1972 г. Б.И. Капранов старший инженер, а с 1973 г. – руководитель группы. В 1975 г. после защиты кандидатской диссертации Б.И. Капранов назначен зам. руководителя лаборатории, а в 1981 г. избран по конкурсу на должность заведующего лабораторией № 82 НИИ электронной интроскопии, в 1986 г. избран по конкурсу на должность доцента кафедры «Физические методы и приборы контроля качества».

В 1986 г. Борис Иванович Капранов зачислен в очную докторантуру ТПУ, тема докторской диссертации – томография с использованием комптоновского обратного рассеяния. В 2000 г. Борис Иванович успешно защитил в диссертационном совете при ТПУ по специальности 05.11.13 диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Разработка метода и средств реконструктивной комптоновской томографии».

В 2002 г., после защиты докторской диссертации, Б.И. Капранов зачислен по контракту на должность профессора кафедры ФМПК ТПУ. За время работы он проявил себя как успешный педагог, организатор учебного процесса и научных исследований. Борисом Ивановичем Капрановым разработаны и читаются три курса для студентов кафедры ФМПК с учетом новых информационных технологий: компьютерные тренажеры, дистанционные курсы с использованием WEB-технологий. Им издано четыре учебных пособия, одно из которых рекомендовано УМО для высших учебных заведений.

Доктор технических наук Б.И. Капранов возглавляет научные исследования по использованию обратно рассеянного рентгеновского и гамма-излучений для контроля объектов в условиях одностороннего доступа. По результатам работ им опубликовано более 60 научных трудов, получено 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Под его руководством создана серия приборов для контроля качества неметаллических материалов и покрытий, которые в настоящее время успешно используются на предприятиях аэрокосмической отрасли.

Европейский научно-промышленный консорциум за вклад в науку, признанный мировым сообществом, наградил Б.И. Капранова медалью им. В. Лейбница. За большой вклад в развитие технологий контроля Борис Иванович награжден Президиумом Федерации космонавтики России медалью им. академика В.П. Макеева.

Научными исследованиями под руководством Б.И. Капранова ежегодно занимаются выпускники кафедры ФМПК, аспиранты. Тематика исследований поддерживается грантами Российского фонда фундаментальных исследований.

**РОНКТД, коллективы ЗАО «НИИ интроскопии МНПО «Спектр»,
Института неразрушающего контроля Томского политехнического университета
и редакции журнала «Территория NDT» сердечно поздравляют Бориса Ивановича с юбилеем
и желают ему и его близким неразрушаемого здоровья, успехов и благополучия.**